

## DF20PC3M

30V 20A

### 特長

- SMD
- 超低  $V_F=0.4V$
- 小型大電流容量

### Feature

- SMD
- Ultra-Low  $V_F=0.4V$
- High Io Rating・Small-PKG

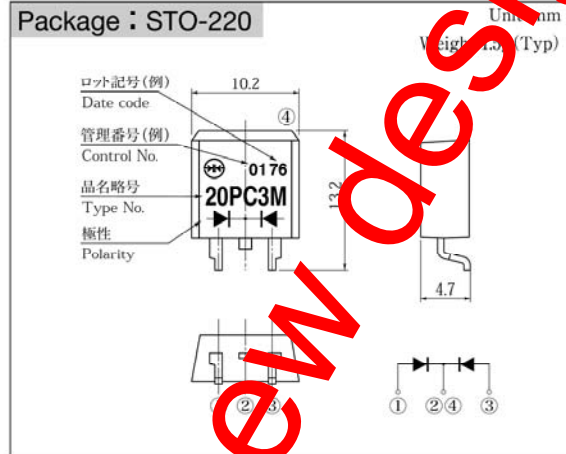
### 用途

- バッテリー逆接防止
- DC出力OR用
- DC/DCコンバータ
- 携帯電話、パソコン

### Main Use

- Reverse connect protection for DC power source
- DC OR-output
- DC/DC Converter
- Mobile phone, PC

### ■外観図 OUTLINE



外形図については新電元.comサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。  
For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

### ■定格表 RATINGS

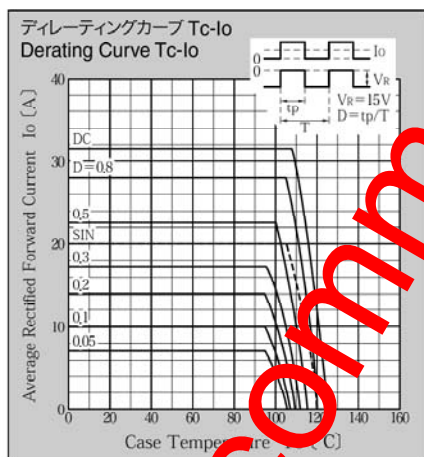
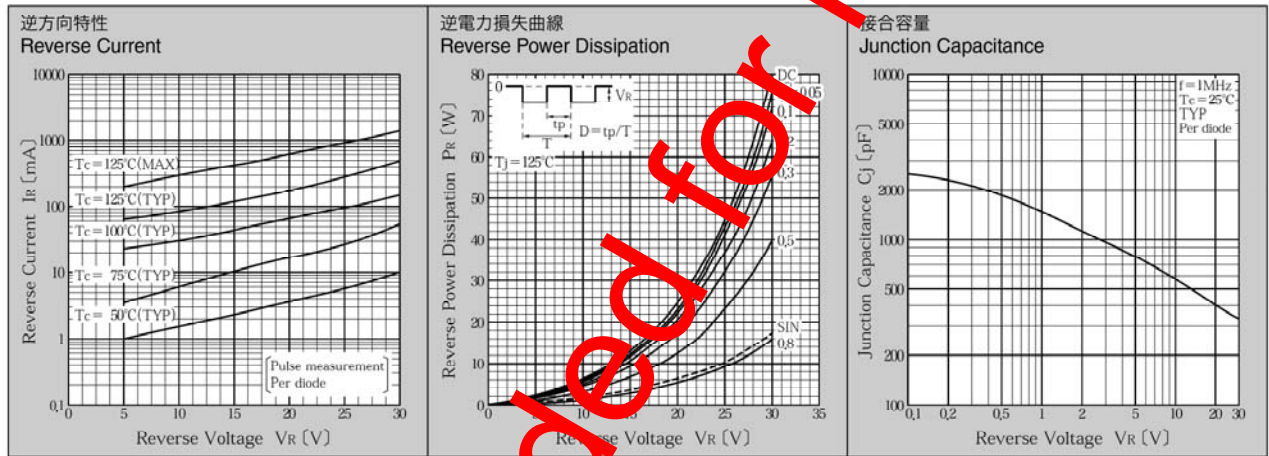
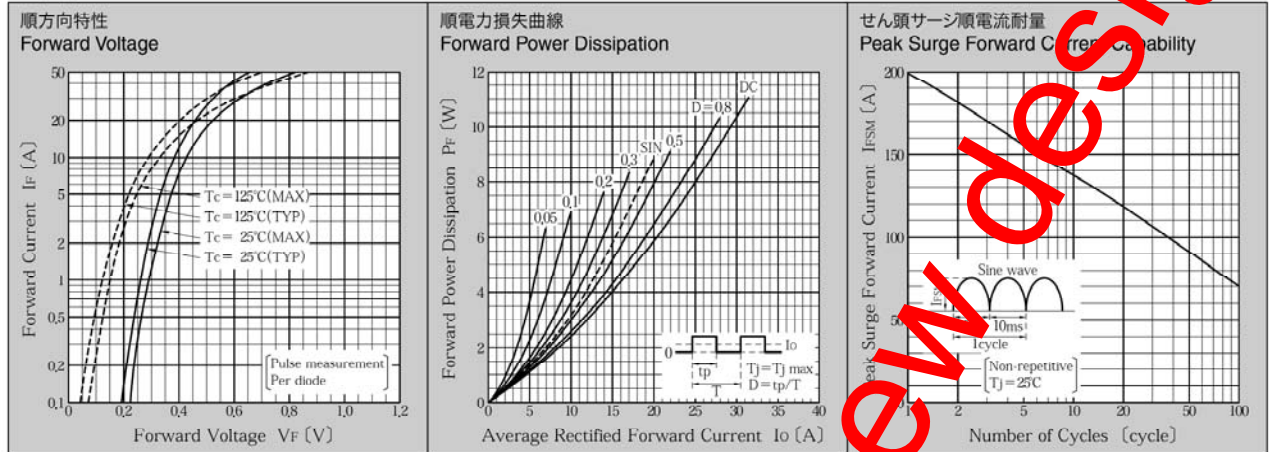
#### ●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_C = 25^\circ C$ )

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DF20PC3M	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$			-55~125	$^\circ C$
接合部温度 Operation Junction Temperature	$T_j$			125	$^\circ C$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	$V_{RM}$			30	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	$V_{RRSM}$	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		35	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	$I_o$	50Hz正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値/2, $T_C = 105^\circ C$ 50Hz sine wave, Resistance load, Per diode $I_o/2$ , $T_C = 105^\circ C$		20	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	$I_{FSM}$	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ C$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ C$		200	A

#### ●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_C = 25^\circ C$ )

順電圧 Forward Voltage	$V_F$	$I_F = 8A$ パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.40	V
逆電流 Reverse Current	$I_R$	$V_R = 30V$ パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 35	mA
接合容量 Junction Capacitance	$C_j$	$f = 1MHz, V_R = 10V$ , 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 560	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	$\theta_{jc}$	接合部・ケース間 junction to case	MAX 1.6	$^\circ C/W$

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



\* Sine waveは50Hzで測定しています。  
\* 50Hz sine wave is used for measurements.  
\* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。  
Typicalは統計的な実力を表しています。  
\* Semiconductor products generally have characteristic variation.  
Typical is a statistical average of the device's ability.